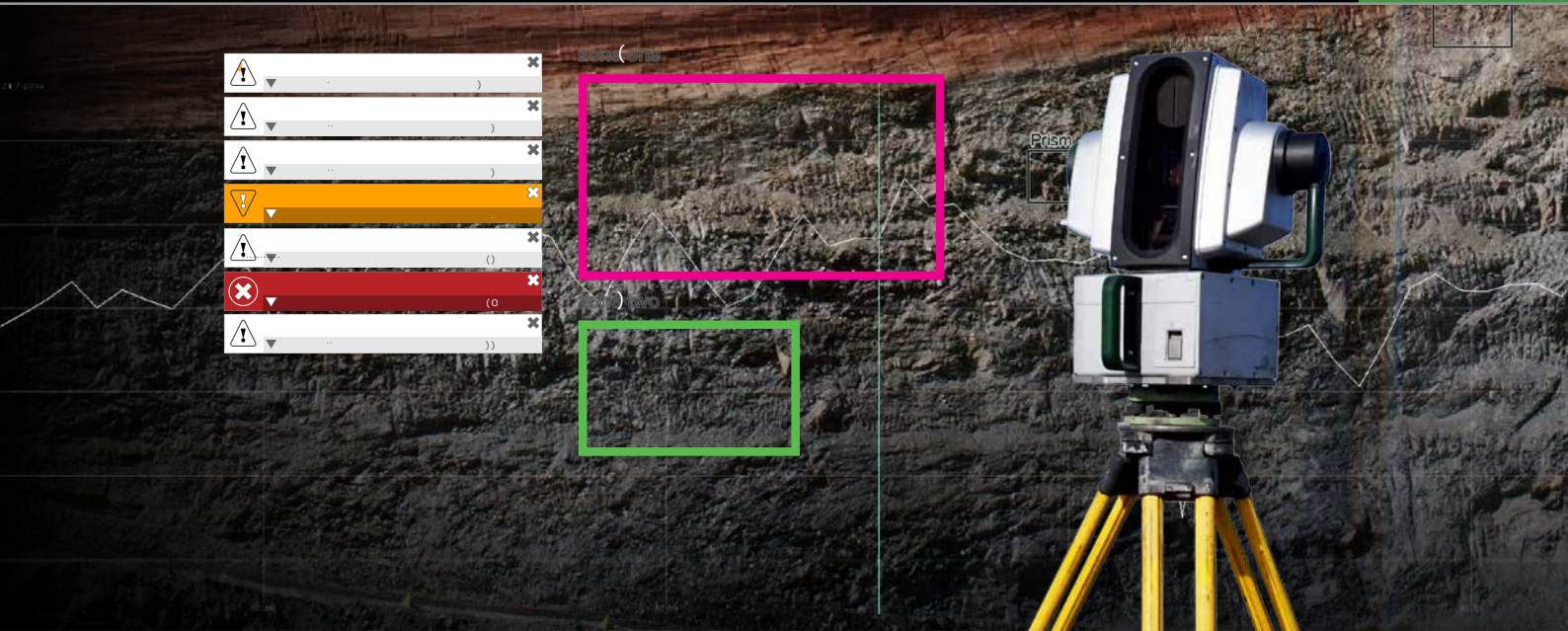


MAPTEK™ Sentry



表面位移趋势分析

Maptek™ Sentry软件是一款直观的可视化和趋势分析工具，用来更好的掌握矿山边坡表面位移状况。

Maptek™ Sentry 将 I-Site 激光扫描数据和精细化软件相结合，跟踪并分析边坡表面随时间的位移变化。

这种通用型的解决方案，能够使专业人员准确的识别出表面位移。Sentry的设置和操作快速简单，用户可以采集准确的数据，确定位移趋势，以便更好的布置雷达系统。

分析 - 集成的平滑工具使用户能够识别出小到每天1毫米的位移变化。结果位移输出与报告能够体现出与雷达系统优良的关联性。

失稳分析 - 与其它系统相比，能够以更高的精确度分析边坡失稳的机制。失稳时间线使得信息能够反馈到现场系统中，以便建立雷达预警。

滑落分析 - 记录岩体滑落信息，并简便地查看滑落起点和坠落点。将数据导出到 I-Site Studio 软件中可以做进一步分析，包括方量计算。同时，及时的更新岩体滑落数据库，还能够降低坡底线附近岩体滑落风险。

通用型设备 - I-Site 激光扫描仪可用于各种测量和监测任务。

Sentry的特点

- 配合测量硬件，监测表面位移
- 可将同一数据应用于其它测量应用
- 与棱镜监测相比更安全
- 专为恶劣矿山环境设计
- 数据以压缩格式存储，以便快速地分析和处理
- 监测同一个场景内多个关注的区域
- 同一台设备可以很容易地监测矿坑内不同的区域
- 更好地掌握失稳机制

Sentry 现场工作模块

将 I-Site 8820 激光扫描仪与安装在配套的平板电脑中的 Sentry 相连。

- 现场直接操控 Sentry
- 建立监测站点并设置监测区域
- 设置报警临界值
- 设置监测频率
- 实时分析并导出分析图表
- 采集的数据保存在坚固耐用的平板电脑中

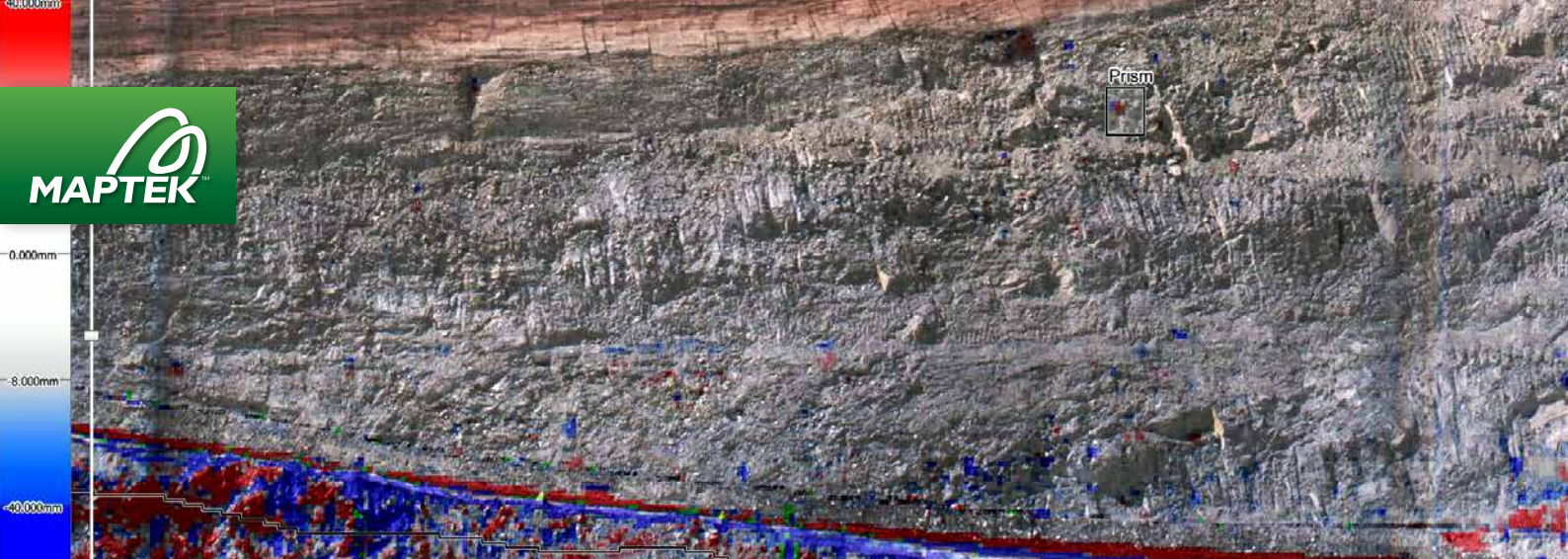
Sentry 办公室工作模块

作为日常测量任务的一部分，扫描重要的区域，然后在办公室分析扫描数据。

- 在办公室使用 Sentry 处理和分析激光扫描数据
- 结合历史记录分析位移趋势
- 确定进一步监测的方式
- 导出定时拍摄的视频和其他报告格式
- 导出原始的激光扫描数据至 I-Site Studio 软件进行高级建模

使用一套激光扫描系统进行日常测量、地质测绘、岩土技术分析、跟踪表面位移并进行位移趋势分析。

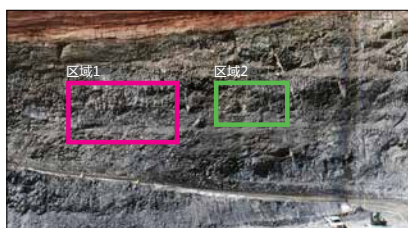




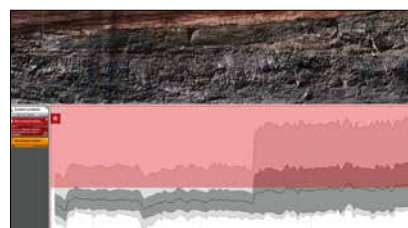
Sentry是怎样工作的



安装I-Site™ 8820激光扫描仪，扫描现场

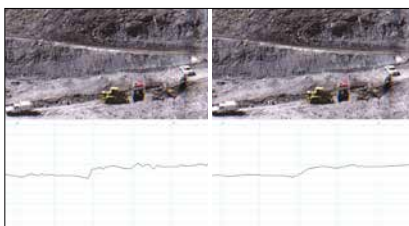


在现场选定区域进行特定区域监测

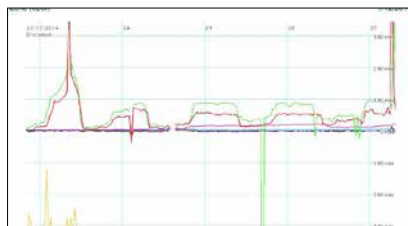


一旦有超出设置临界值的位移变化，立即自动报警

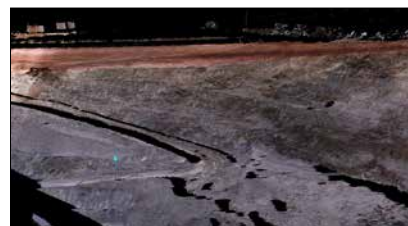
分析和报告



直观的可视化功能帮助判定位移趋势。集成的平滑工具使用户能够识别出小到每天1毫米的位移变化。



生成位移、速度和反速度图表。导出PDF格式文件，生成定时拍摄视频。



能将数据无缝导出至I-Site Studio软件做进一步分析。

数据查询

- 三维数字地形模型 (DTM)
- 覆盖了热图的三维图像
- 对单次扫描进行空间平均，提高灵敏度
- 直观的算法减少扫描噪点干扰
- 数据以压缩格式存储，以便快速地分析和处理
- 原始扫描数据可用于其他应用

报警提示

- 汇报同一个现场的多个监测区域情况
- 可以设置位移、速度和反速度临界值来触发报警
- Sentry联网时可以自动生成电子邮件通知
- 软件内置通知设置面板

分析图表

- 自定义生成分析图表
- 图表可以报告位移、速度和反速度

深入分析

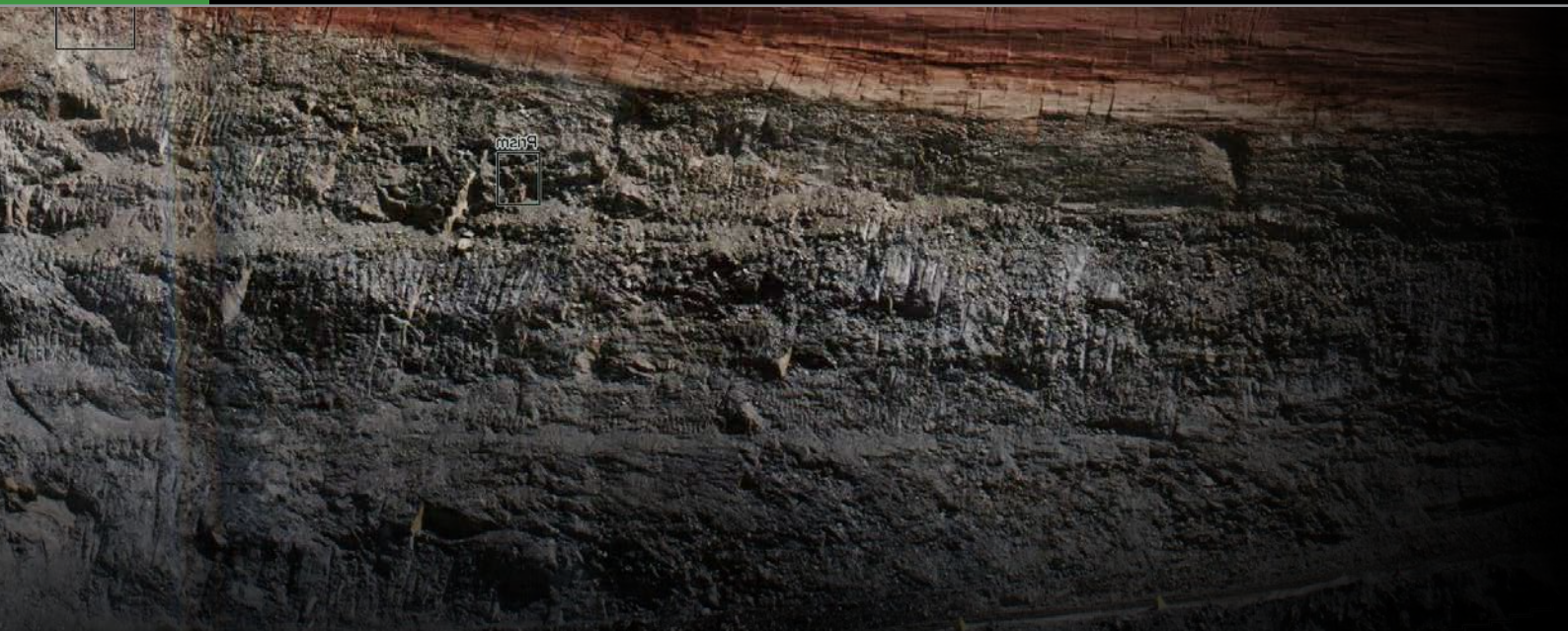
- 使用同样的数据在I-Site Studio中分析落石位移
- 在I-Site Studio中计算方量并进行地质测绘



行业领先的全局解决方案

Maptek是全球领先的矿业创新软件、硬件以及技术服务供应商，在75个国家有超过1700名客户依赖于Maptek公司的产品与服务。

Maptek矿业技术贯穿整个采矿流程，所提供的解决方案可帮助用户降低运营成本、提高生产效率和盈利能力。此外，Maptek还提供专业的咨询、培训和技术支持服务，以确保用户充分利用Maptek的产品更好的完成工作。



www.maptek.com.cn
TEL: 4000627835

